Oxygen Gas-Sheet Beam Profile Monitor for the Synchrotron and Storage Ring

Yoshinori Hashimoto^{1,A)}, Takashi Fujisawa^{B)}, Teruhisa Morimoto^{A)}, Yuzo Fujita^{A)},

Toshihiro Honma^{B)}, Suguru Muto^{A)}, Koji Noda^{B)}, Yukio Sato^{B)},

Tomonori Uesugi^{B)}, Satoru Yamada^{B)}

^{A)}High Energy Accelerator Research Organization (KEK)

Oho 1-1, Tsukuba-shi, Ibaraki 305-0801 ^{B)} National Institute of Radiological Sciences (NIRS)

4-9-1 Anagawa, Inage-ku Chiba-shi, Chiba 263-8555

Abstract

A fast, non-destructive beam-profile monitor^[1,2] was developed using an oxygen gas-sheet target in the HIMAC synchrotron^[3]. The size of the gas-sheet target was 85 mm in width and 1.3 mm in thickness, of which the density was 1 x 10^{-4} Pa. The base vacuum in the ring was not deteriorated by this gas-sheet target, and was on the order of 10^{-8} Pa. In typical cases, carbon ion beams are accelerated from 6 to 290-430 MeV/n for cancer therapy, in which the intensity is 2.5 x 10^{8} particles/bunch. For these beams, two-dimensional beam profiles were successfully measured within the time (~100 ns) of the bunch separation. This article describes both the technical and physical aspects of the monitor together with some results.

酸素分子ガスシートを用いたビームプロファイルモニター

1. 概要

年々高精度化しているイオンシンクロトロンでの ビームオペレーションとビームダイナミクスの研究 から、非破壊型の高速のビーム診断ツールへの要求 が高まっている.しかし、高速のビームプロファイ ル計測を、特にHIMAC^[3]のようなビーム強度が低く かつ超高真空領域となるシンクロトロンで行うこと は、従来の残留ガスモニター^[4]ではイオン対発生数 が少なく、計測時間に10ms以上を要し困難である.

この克服のために、ガスターゲットを用いて電離 イオン数を増すアイデアが、CERNのISRやLEARで、 ナトリウムやカーボンを用いて実現された^[5,6].それらは、高い電離イオン効率を有したが、例えばバ ンチ時間程度の高速の検出器ではなかった.私たち は、二次元実像ビームプロファイルをいかに高速に 計測できるかに本開発のポイントを絞った.

ガスターゲット密度を十分に高く,かつモニター サイズをコンパクトにするために,ノズルビーム法 「¹をパルス化して採用した.高速検出を行うために, 2段構成のマイクロチャンネルプレート(MCP)とイ メージングスクリーンを用いて,電離イオンを電荷 増幅して映像化し,それをイメージインテンシファ イアチューブ(IIT)を付けたCCDカメラで計測した. さらに,酸素分子線を用い,不均一多極磁場をその 磁気モーメントに作用させる収束装置を開発し, ターゲット密度を2倍に向上させた^[8].

2. 分子線発生装置

図1に、酸素分子ガスシート発生装置の概念図を

示す. 装置は5室の真空差動排気系で構成され,各 室1000 lsのポンプをもつ. 酸素分子ビームは, gasjet chamber 内のノズルとスキマーで120 μ sのパルス で出射され,最終段のdetector chamber に向かって 走る. ノズルからターゲット中心までの距離は1230 mm であり,走行時間約1.7 ms を要する.



図1. 酸素分子ガスシート発生装置.

分子線はノズルビーム法で発生させる. 0.6 MPa 程度の高圧酸素ガスを, 1.7 mm のノズルから真空 中に放出し,断熱自由膨張を生じさせる. ノズル直 後では,高い頻度の分子同士の衝突により,分子は 冷却されると共に運動量が揃い,ノズル中心からほ ぼ等方的な運動方向をもつ分子線となる. この自由 膨張領域内に,分子線中心部以外の不要分子を剥ぎ 取る目的でスキマー(開口サイズ:2.0^H×3.0^Wmm²)を 置く. 生成された酸素分子線は,735 m/s の終端速 度をもち,分子温度は,10 K程度となる^[1,7].

次室のSlit chamber では,発散する不用な分子

¹ E-mail: yoshinori.hashimoto@kek.jp

線をスリットでカットする.酸素分子線は、次の磁 石での収束と併せてシート状に成形される.

Magnet-chamberでの収束は,酸素分子が,2 bohrmagneton の磁気モーメントをもちスピンが1である ことを利用している^[8].磁場勾配をもつ多極磁石(図 2)は,Nd-Fe-Bの永久磁石 (remanent Br, 1.28 T; max. BH product, 318 kJ/m³)と高透磁率磁性体パーメン ジュール (saturation Bs, 2.3 T)で構成され,磁極対 数17,分子線進行方向の磁石長159mm,奥行70 mm である.収束力の調整のため,鉛直方向の磁極間隔 は4~15mm まで大気側から変えることができる. 磁極間隔12 mm の場合に,焦点距離260 mmとなり, ターゲット密度を2倍に向上させることができる^[8].



図2. 多極磁石を用いた収束磁石

ターゲットの特性測定は、HIMACへのインス トール前に、スリット($15^{W} \times 0.5^{H} mm^{2}$)を前面につ けたBA ゲージで行った.ターゲット厚みは、最大 ガス密度となる磁石条件で1.3 mm (FWHM)であった ^[1].ターゲットは仰角45度をもつため(図4)、シンク ロトロンビームから見た実効厚みは、1/cos45 した 1.84 mm となる.ガス圧0.6 MPa の時、ターゲット 密度は、 1.0×10^{4} Paで最大となった^[1, 2].ガスシー トの幅方向空間密度分布(図3)は、全幅85mmで、約60 mmの平坦部を有する.

ガスシートを発生させるとmonitor chamber (リン グ)の圧力は、3×10⁸から7×10⁷ Paまで上昇する. これは分子線発生装置で引ききれないガスが遅れて 流入してくるためであり、この圧力変化は、100ms で回復する.この間リング上下流5mの地点での圧 力変化は全く生じていない.2台のイオンポンプが 有効に機能しているためと考えられる。



図3. ガスシートターゲットの幅方向の空間分布

3. ビームプロファイル計測装置

図4に検出系の概念図を示す.シンクロトロン ビームとの衝突で発生する酸素イオン収集の電場は, ステンレス製のイオン収集電極[外径:230 mm Φ ,間 隔:70 mm]に、上下-/+4.5kV 程度の電圧を印加して、 作られる. MAFIAの計算による検出位置のズレは、 MCPの有効径100 mm ϕ のうち、中央部の70 mm ϕ の範囲 で0.1 mm 以下、最外部で0.3 mm である.また、こ の電場によるシンクロトロンビームへのキックの補 正のため、リングの上下流それぞれ350 mm 離れた 位置に、補正電極が設置されている(図4).



図4. ビームプロファイル検出装置

2段構成のMCP(浜松ホトニクスF2395-24PX,最大 印加電圧/ゲイン:DC2kV/5×10⁶)では,有効径 100mm ゆで到達した酸素イオンの荷電増幅を行う. MCP出口のスクリーン(発光波長:410nm)では,MCPか ら出射される電子によりビーム像を映像化する.単 バンチ時間内(HIMACのバンチ間隔:125 ns-1µs)で の計測のため,スクリーンの光強度の減衰時間(光 量が1/10になるまで)は80 nsと短いものを選んだ. より正確なビーム計測のため,検出器鉛直下方か ら,よくコリメートされた紫外光(波長~200nm)を MCP全面にスイープ照射し,検出器の感度分布を測

り,その値でビームプロファイルが補正される. スクリーンのビーム像は,大気側に設置された IIT (浜松ホトニクスC2925,最大ゲイン:1×10⁴, 時間ゲート:3ns-DC)を付けたCCD カメラでビー ムに同期して検出される(図4).

この高感度な検出系の増幅率は,MCPゲインが 1 ×10⁵の時,MCPでの一つの二次電子が,IITの光電 面で600 光電子となると見積もっている^[1].

検出限界と直線性の試験^[1,2]は、開発段階にNIRS-930サイクロトロンの8 MeV取り出し陽子ビーム(電流:3 μ A, FWHMサイズ:4.5 mm ϕ)を用いて行った. ク リアなビーム像は、20 μ s (IITゲート時間)までであ り、それより短い時間では、まばらな星状の像と なった. Bethe-Bloch formula を用いて、このとき 生成されたイオン対のflux densityを見積もると 2.9 ×10⁵ ions/mm²/sであり、イオン対数は約100で あった. この値が検出限界を示す一つの目安となる. 検出器のダイナミックレンジは、ビーム電流503000nA の範囲で, IITゲート時間20µs で20回の平 均を計測した(図5). 直線性はきわめて良好であり, 固定ゲインのダイナミックレンジは約60であった.



図5.8 MeV陽子ビームの強度と計測された光量

検出器の分解能は、HIMACの電子冷却で非常に細く絞った6MeV/uのAr¹⁸⁺ビームを用いて評価した^[1,2]. 水平方向で0.76 mm, 垂直方向で1.51mm のサイズま で計測することができた.垂直方向は、ターゲット の厚みの影響で大きいと考えられる.

4. ビームプロファイル計測

4.1 加速ビーム



図6.¹²C⁶⁺の単バンチのビームプロファイル



図7. 入射から取り出しまでの¹²C⁶⁺の加速ビーム

2002年5月からHIMACでのビーム計測を開始した. まずHIMACで通常のガン治療に用いられる¹²C⁶⁺ ビームで,エネルギー350 MeV/u,バンチあたりの 粒子数2.5×10⁸の時,バンチ間隔よりも十分に短い 100ns のIITゲート時間で,クリアな二次元ビーム像 を計測することができた(図6(a)). 図6(b)には, 水平, 垂直方向への射影を示す.また同条件で,入 射から取り出しまで(6-430 MeV/u) 10回平均で計 測した.図7に示す様に加速中の断熱減衰,取り出 し時の様子を見ることができた.

4.2 電子冷却^[9,10]された重イオンビーム

エネルギー6 MeV/u のAr¹⁸⁺ コースティングビー ム(粒子数1×10⁶)の電子冷却過程を, IITゲート時間 100µsで計測した. プロファイルとその射影を, そ れぞれ図8(a), (b)に示す. 3s 後には, ビームはよく 冷却され, 水平, 垂直方向のサイズは, それぞれ, 1.82, 2.20 mm まで小さくなった.



図8.6 MeV/u のAr¹⁸⁺(粒子数1×10⁶)の電子冷却

ガスターゲットのビームへの影響として,散乱 や荷電変換などが考えられるため,静電モニターの ショットキー信号の周回周波数スペクトラムを詳細 に調べたが,有意な変化は観測されなかった.

5. まとめ

HIMACにおいて,酸素分子ガスターゲットを用 いた高速非破壊型ビームプロファイルモニターを開 発した.HIMAC の典型的なガン治療ビームである $^{12}C^{6+}$ (強度: 2.5 × 10⁸ ppb)で,エネルギー6-430 MeV/u の時,二次元実ビーム像のバンチ間隔時間 内100 nsでの計測に成功した.電子冷却されたAr¹⁸⁺ の冷却過程もクリアに計測することができた.

参考文献

- [1] Y. Hashimoto, et al., Nucl. Instr. and Meth. A527(2004)289.
- [2] 橋本義徳 他, 加速器学会誌, Vol. 1, No. 3, 2004, p. 216-224
- [3] S. Yamada, Proc. of 2nd APAC, Beijing, 2001, p. 829-834.
- $\left[4\right]$ T. Honma, et al., Nucl. Instr. and Meth. A 490 (2002) 435.
- [5] B. Vosicki, et al., IEEE Trans., NS-22 (1975) 1475.
- [6] R. Galiana, et al., Proc. of PAC, USA, 1991, p. 1198-1200.
- [7] D. R. Miller, "Atomic and Molecular Beam Methods, Volume 1", Edited by Giacinto Scoles, New York, Oxford Press, (1988) p.14.
- [8] T. Fujisawa, Y. Hashimoto, T. Morimoto, Y. Fujita, Nucl. Instr. and Meth. A 506 (2003)50-59.
- [9] K. Noda, et al., Nucl. Instr. and Meth. A441(2000) 159-166.
- [10] K. Noda, et al., Proc. of 8th EPAC, Paris, 2002, p.1380-1382.